



SS-700

亚微米电路/射频测试针座

规格: X-Y-Z方向行程: 8 x 8 x 8mm; 运动方式: 线性移动; 丝杠精度: 700Thread/Inch; 移动精度: 0.1 微米

尺寸: 148mm长*120mm宽*140mm高; 重1500 克

特点: •亚微米工艺集成电路电路测试 •线性, 无后座力移动 •可以配合同轴/三轴探针夹具使用 •夹具可以30度范围倾仰 •可以使用钨探针 •可以配置为东/南/西/北四个方向的射频针座 •射频测试能力: 直流到40GHz~120GHz •可以配合使用校准片和校准软件 •探头接口和线缆45度连接, 无需L型转接头 •探头可以拆卸维修 •带射频测试线固定装置



SS-100

亚微米电路/射频测试针座

规格: X-Y-Z方向行程: 12x12x12mm; 运动方式: 线性移动; 丝杠精度: 40Thread/Inch; 移动精度: 0.7微米

尺寸: 115mm长*100mm宽*112mm高; 重1000 克左右

特点: •亚微米工艺集成电路电路测试 •线性, 无后座力移动 •可以配合同轴/三轴探针夹具使用 •夹具可以30度范围倾仰 •可以使用钨探针 •可以配置为东/南/西/北四个方向的射频针座 •射频测试能力: 直流到40GHz~120GHz •可以配合使用校准片和校准软件 •探头接口和线缆45度连接, 无需L型转接头 •探头可以拆卸维修 •带射频测试线固定装置



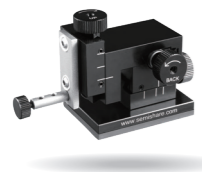
SS-40-T

电路/射频测试针座

规格: X-Y-Z方向行程/12x12x 12mm; 运动方式: 线性移动; 丝杠精度: 40 Thread/Inch; 移动精度: 2微米

尺寸: 64mm长*47mm宽*66mm高; 重200 克左右

特点: •线性移动 •I/O Pad 点测 •电路点测 •射频测试 •较小的体积 •可以配合同轴使用



SS-40

I/O Pad/Electro-Optics光电测试针座

规格: X-Y-Z方向行程: 12x12x12mm; 运动方式: 线性移动; 丝杠精度: 40 Thread/Inch; 移动精度: 10微米

尺寸: 64mm长*47mm*55mm高; 重175 克左右

特点: •价格实惠 •线性移动 •I/O Pad 点测 •光电器件点测 •体积小 •可以配合同轴/三轴探针夹具使用

探针夹具是固定在针座上面连接探针和信号线缆的机械装置,用于固定探针和引出信号。探针夹具会随着针座的 X-Y-Z旋钮调节而在 X-Y-Z方向线性运动。

选型步骤:

请先根据测试电极的大小选定针座的型号,而后根据电信测试精度确定探针夹具后端使用普通线缆,同轴线缆或者三轴线缆。选择时注意针座的机械精度。

同轴探针夹具

同轴探针夹具后端连接1.2米长的带BNC(同轴公)接口的同轴线缆。在使用标准屏蔽箱时电信测试精度优于10 pA。



三轴探针夹具

三轴探针夹具:三轴探针夹具后端连接1.2米长的带三轴(公)接口的三轴线缆。在使用标准屏蔽箱时电信测试精度优于100fA。

